

Available now

Time-of-Flight SIMS

Sleek New Design

PHI nanoTOF 3



複雑な形状の試料も高い質量精度で測定可能

- ・ トリプルフォーカス静電アナライザーによる高精度分析

パラレルイメージングMS/MSによる分子構造解析

- ・ 最表面のタンデム質量分析を高速・高感度で実現

位置精度と再現性に優れた自動搬送、自動ステージにより サンプルハンドリングがより簡単に

- ・ 試料自動搬送 ・ パーキング機構 (x1) ・ 自動分析

測定試料に関係なく調整不要の中和を実現

- ・ 低エネルギー電子線とイオンビームの同時照射による信頼性の高い帯電補正機構

自動化とリモートアクセス機能が、より快適な測定環境を実現

- ・ 容易なナビゲーションと信頼性の高い自動化技術で自動測定を実現
- ・ 「リモート測定」と「遠隔診断」を可能にするリモートアクセス機能に対応

Φ ULVAC-PHI, INC.

TOF-SIMS

